

HANWA プライベートショー

個別相談！参加無料！

HANWA 製品を毎月ご紹介させて頂きます。実際にサンプル測定をして頂いても構いません。
また、専門の技術者が個別に対応させて頂きますので、じっくりご相談いただけます。

場 所： テクニカルサポートセンター
東京都大田区大森北1丁目17番2号 大森センタービル403号
電話番号： 03-5767-5677
F A X： 03-5767-5688

プライベートショー日程

日程	時間	製品
5/14(木)	13:00~17:00	TLP 試験器 (HED-T5000) 本装置は、Transmission Line を利用して、ESD 保護素子の特性の測定を行う装置です。 従来、ESD 保護素子の性能の評価方法は、ESD パルスを印加後の破壊か否かの合否判定により測定していました。そのため、破壊判定による ESD 保護素子の評価だと、保護回路の特性が見えにくいいため、効率のよい設計変更が行えません。本装置は、非破壊により ESD 保護素子の特性を定量的に測定できるため、効率のよい設計変更が行え、開発時間とコストの削減が行えます。
5/15(金)	9:00~16:00	
6/18(木)	13:00~17:00	静電破壊自動測定装置(HED-N5000&HED-S5000) 本装置は独自のメカニカル機構により、最大 1024 ピンのデバイスまで試験が可能になっています。占有スペースも小さく、従来の少ピン対応の装置ほどしかありません。試験機能は最新規格に合った静電気試験、ラッチアップ試験に対応し、フレンドリーな操作性で精度の高い試験が実現できます。
6/19(金)	9:00~16:00	
7/14(火)	13:00~17:00	コンパクト ESD 試験器(HCE-5000) ESD 試験器の持ち運びが簡単 LSI イミュニティーテスター (誤動作試験器) (HIT-5000) インパルスの立上がり、立下り波形をコントロール可能
7/15(水)	9:00~16:00	CDM 試験器 (HED-C5002) 工場ラインの自動化に伴い、デバイス帯電の静電破壊が重要視されています。
9/17(木)	13:00~17:00	Wafer ESD テスター (HED-W5100D & HED-W5000M) Wafer・Level での ESD 試験を可能にしました。
9/18(金)	9:00~16:00	TLP 試験器 (HED-T5000) 本装置は、Transmission Line を利用して、ESD 保護素子の特性の測定を行う装置です。
11/19(木)	13:00~17:00	静電破壊自動測定装置(HED-N5000&HED-S5000) 試験機能は最新規格に合った静電気試験、ラッチアップ試験に対応し、フレンドリーな操作性で精度の高い試験が実現できます。
11/20(金)	9:00~16:00	